

TESIS

RANCANG BANGUN *SPECTROSCOPIC ELLIPSOMETRY* UNTUK MENGUKUR KONSTANTA DIELEKTRIK DAN KETEBALAN LAPISAN TIPIS GRAPHENE/SiO₂ MENGGUNAKAN SUMBER CAHAYA PANJANG GELOMBANG TUNGGAL (632,8 nm)

DESIGN SPECTROSCOPIC ELLIPSOMETRY TO MEASURE DIELECTRIC CONSTANTS AND THICKNESS OF GRAPHENE/SiO₂ USING SOURCE LIGHT SINGLE WAVELENGTH (632,8 nm)

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh derajat

Master of Science Ilmu Fisika



KIKI MEGASARI

13/354930/PPA/04321

**PROGRAM STUDI S2 ILMU FISIKA
JURUSAN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2015**